1. **口井 敏匡, 四柳 浩之 :** 半導体集積回路，スキャン回路設計方法，テストパターン生成方法，および，スキャンテスト方法, 特願2004-225962 (2004年8月), 特開2006-047013 (2006年2月), .
2. **橋爪 正樹, 一宮 正博 :** 電源電流による検査容易化論理回路, 特願2006-112885 (2004年10月), .
3. **橋爪 正樹, 山達 正明 :** 固体撮像装置およびその特性検査方法, 特願2006-032796 (2006年2月), 特許第3932052号 (2007年3月).
4. **一宮 正博, 橋爪 正樹 :** 論理回路の断線故障の検査装置, 特願2006-114044 (2006年4月), .
5. **橋爪 正樹, 一宮 正博, 四柳 浩之 :** 電子回路の断線故障検査法とその検査容易化回路, 特願2006-309430 (2006年11月), 特開2008-122338 (2008年5月), .
6. **宋 天, 山田 篤, 島本 隆 :** 算術符号化装置，算術符号化方法，算術符号化プログラム及びプログラムを格納したコンピュータで読み取り可能な記録媒体, 特願2008-503883 (2007年3月), 特開WO2007/102518 (2007年9月), 特許第4547503号 (2010年7月).
7. **宋 天, 板東 孝文, 島本 隆 :** 動画像符号化装置，動画像符号化方法，動画像符号化プログラム及びコンピュータで読み取り可能な記録媒体, 特願2011-088674 (2011年4月), 特許第5950260号 (2016年6月).
8. **矢崎 徹, 植松 裕, 池田 康浩, 橋爪 正樹, 四柳 浩之, 伊喜利 勇貴 :** 半導体装置，及び半導体集積回路, 特願2017-107547 (2017年5月), 特開2018-206829 (2018年12月), 特許第2017-107547号 (2018年12月).